電子機器用可変抵抗器―第２部：ブランク個別規格：ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器　評価水準Ｆ	Ｃ5260―２―２
電子機器用可変抵抗器―第３部：品種別通則：回転形精密級可変抵抗器	Ｃ5260―３
電子機器用可変抵抗器―第３部：ブランク個別規格：回転形精密級可変抵抗器　評価水準Ｅ	Ｃ5260―３―１
電子機器用可変抵抗器―第４部：品種別通則：単回転電力形可変抵抗器	Ｃ5260―４
電子機器用可変抵抗器―第４部：ブランク個別規格：単回転電力形可変抵抗器　評価水準Ｅ	Ｃ5260―４―１
電子機器用可変抵抗器―第４部：ブランク個別規格：単回転電力形可変抵抗器　評価水準Ｆ	Ｃ5260―４―２
電子機器用可変抵抗器―第５部：品種別通則：単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器	Ｃ5260―５
電子機器用可変抵抗器―第５部：ブランク個別規格：単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器　評価水準Ｅ	Ｃ5260―５―１
電子機器用可変抵抗器―第５部：ブランク個別規格：単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器　評価水準Ｆ	Ｃ5260―５―２
電子機器用電源変圧器品目別通則	Ｃ5310
電子機器用電源変圧器試験方法	Ｃ5311
電子機器用高周波コイル及び中間周波変成器通則	Ｃ5320
電子機器用高周波コイル及び中間周波変成器試験方法	Ｃ5321
低圧サージ防護デバイス用ガス入り放電管（ＧＤＴ）	Ｃ5381―311
低圧サージ防護デバイス用アバランシブレークダウンダイオード（ＡＢＤ）の試験方法	Ｃ5381―321
低圧サージ防護デバイス用サージ防護サイリスタ（ＴＳＳ）の試験方法	Ｃ5381―341
電子機器用コネクター第４部：品種別通則―プリント配線板用コネクター品質評価付	Ｃ5401―４
電子機器用コネクター第４―001部：プリント配線板用コネクター品質評価付―ブランク個別規格	Ｃ5401―４―001
電子機器用コネクター試験及び測定―第１―１部：一般試験―試験１ａ：外観	Ｃ5402―１―１
電子機器用コネクター試験及び測定―第１―２部：一般試験―試験１ｂ：寸法及び質量	Ｃ5402―１―２
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―10部：耐候性試験―試験11ｊ：低温	Ｃ5402―11―10
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―11部：耐候性試験―試験11ｋ：減圧	Ｃ5402―11―11
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―12部：耐候性試験―試験11ｍ：温湿度サイクル	Ｃ5402―11―12
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―13部：耐候性試験―試験11ｎ：ガスタイト・無はんだラッピング接続	Ｃ5402―11―13
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―２部：耐候性試験―試験11ｂ：低温・減圧・湿度複合シーケンス	Ｃ5402―11―２
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―３部：耐候性試験―試験11ｃ：高温高湿（定常）	Ｃ5402―11―３
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―４部：耐候性試験―試験11ｄ：温度急変	Ｃ5402―11―４
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―５部：耐候性試験―試験11ｅ：かびの成長	Ｃ5402―11―５
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―６部：耐候性試験―試験11ｆ：腐食，塩水噴霧	Ｃ5402―11―６
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―９部：耐候性試験―試験11ｉ：高温	Ｃ5402―11―９
電子機器用コネクター試験及び測定―第12―７部：はんだ付け試験―試験12ｇ：はんだ付け性，平衡法	Ｃ5402―12―７
電子機器用コネクター試験及び測定―第２―１部：導通及び接触抵抗試験―試験２ａ：接触抵抗―ミリボルトレベル法	Ｃ5402―２―１
電子機器用コネクター試験及び測定―第２―２部：導通及び接触抵抗試験―試験２ｂ：接触抵抗―規定電流法	Ｃ5402―２―２
電子機器用コネクター試験及び測定―第２―３部：導通及び接触抵抗試験―試験２ｃ：接触抵抗の変動	Ｃ5402―２―３
電子機器用コネクター試験及び測定―第２―６部：導通及び接触抵抗試験―試験２ｆ：ハウジング（シェル）の導通性	Ｃ5402―２―６
電子機器用コネクター試験及び測定―第20―２部：耐火性試験―試験20ｂ：耐火性	Ｃ5402―20―２
電子機器用コネクター試験及び測定―第23―３部：スクリーニング及びフィルタリング試験―試験23ｃ：コネクタ及びアクセサリのシールド効果	Ｃ5402―23―３
電子機器用コネクター試験及び測定―第３―１部：絶縁試験―試験３ａ：絶縁抵抗	Ｃ5402―３―１
電子機器用コネクター試験及び測定―第４―２部：電圧ストレス試験―試験４ｂ：部分放電	Ｃ5402―４―２
電子機器用コネクター試験及び測定―第４―３部：電圧ストレス試験―試験４ｃ：耐電圧（絶縁被覆付クリンプバレル）	Ｃ5402―４―３
電子機器用コネクター試験及び測定―第５―１部：電流容量試験―試験５ａ：温度上昇	Ｃ5402―５―１
電子機器用コネクター試験及び測定―第５―２部：電流容量試験―試験５ｂ：電流・温度の軽減	Ｃ5402―５―２
電子機器用コネクター試験及び測定―第６―１部：動的ストレス試験―試験６ａ：加速度（定常）	Ｃ5402―６―１
電子機器用コネクター試験及び測定―第６―２部：動的ストレス試験―試験６ｂ：バンプ	Ｃ5402―６―２
電子機器用コネクター試験及び測定―第６―３部：動的ストレス試験―試験６ｃ：衝撃	Ｃ5402―６―３
電子機器用コネクター試験及び測定―第６―４部：動的ストレス試験―試験６ｄ：正弦波振動	Ｃ5402―６―４
制御用小形電磁リレーの試験方法	Ｃ5442
磁気テープ録音再生システム　第３部　磁気テープ録音再生機器の特性測定方法	Ｃ5564
ＶＨＳ方式12.65㎜（0.5in）磁気テープヘリカル走査ビデオカセットシステム	Ｃ5581
８㎜ビデオ―８㎜磁気テープヘリカル走査ビデオカセットシステム	Ｃ5583
ディペンダビリティ　マネジメント―第１部：ディペンダビリティ　マネジメントシステム	Ｃ5750―１
ディペンダビリティ　マネジメント―第２部：ディペンダビリティ　マネジメントのための指針	Ｃ5750―２
光伝送用受動部品試験方法	Ｃ5901
シングルモード光ファイバピッグテール型光サーキュレータ	Ｃ5915
シングルモード光ファイバピッグテール型固定光減衰器	Ｃ5921
光伝送用レンズ試験方法	Ｃ5935
光伝送用半導体レーザモジュール通則	Ｃ5944
光伝送用半導体レーザモジュール測定方法	Ｃ5945
光ファイバ増幅器用半導体レーザモジュール通則	Ｃ5946
光ファイバ増幅器用半導体レーザモジュール測定方法	Ｃ5947